

'95 Digital OBIC Scanner セミナー

会場：日本薬学会 長井記念ホール

会期：平成7年9月26日(火)

プログラム

10:30~11:00 受付

11:00~11:05 ご挨拶

11:05~12:00 「高感度OBICの原理とデバイス・液晶パネルへの応用」
日本電子ライオソニック株式会社 原口 康史

12:00~13:00 <昼 食>

13:00~13:30 「OBICを用いたCMOS・LSIの故障解析事例」
旭化成マイクロシステム株式会社 小澤 弘晃

13:30~14:00 「OBICを用いたLSIの故障解析事例」
富士通VLSI株式会社 柏木 隆光

14:00~14:30 「裏面OBICの開発」
日本電子ライオソニック株式会社 上田 勝英

14:30~14:45 <コーヒープレイク>

14:45~15:35 「レーザビーム照射加熱を利用したLSIの故障解析手法」
日本電気株式会社 二川 清

15:35~16:15 「熱起電力を原理とするOBIC解析」
三菱電機株式会社 小山 徹

16:15~16:20 ご挨拶

16:30~18:00 懇親会